

Application No.	Applicant(s)	_
09/938,328	SCOTTO ET AL	
Examiner	Art Unit	
Tan Dean D. Nouven	3629	

SEARCHED						
Class	Subclass	Date	Examiner			
705	1	9/2dox	DN			
	題奏					
	7					
	g					
	q.	4	\bigvee			
	10					
	35		V			
		•				

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR .		
	al (
US patent PG Pub	9/2dox	251		
PG Pub				
Foreign 000 JPO Derwent				
·				
	·			
·				